

PACS: 42.70.Qs, 73.21.Cd, 78.67.Pt, 71.36.+c

В.В. Румянцев, С.А. Федоров

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В ДЕФОРМИРОВАННОМ МАССИВЕ МИКРОРЕЗОНАТОРОВ

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина

Статья поступила в редакцию 17 сентября 2016 года

Исследован поляритонный спектр бинарной двумерной сверхрешетки связанных микро-резонаторов, содержащих одноуровневые квантовые точки. Показано, что с помощью упругих деформаций можно управлять поляритонным спектром исследуемой системы и таким образом изменять ее энергетические и оптические свойства.

Ключевые слова: поляритонный спектр, тензор деформации, микрорезонатор, квантовая точка

1. Введение

Огромную область экспериментальных и теоретических исследований на стыке различных научных направлений физики конденсированного состояния занимает разработка новых материалов, которые используются в качестве источников когерентного излучения [1,2]. При этом значительный интерес представляют исследования, связанные с возможностью контролировать распространение электромагнитных возбуждений в полученных композитных структурах, с модификацией их физических свойств в результате внешних воздействий (например, упругой деформации [1]). При создании таких материалов приходится решать проблемы, возникающие при формировании новых структур – поляритонных кристаллов [2,3] (особого класса фотонных кристаллов [4]), в которых реализуется сильная связь квантовых возмущений среды (экситонов) и оптического поля. В частности, такой поляритонной структурой может быть пространственно-периодическая система микропор (связанных микрорезонаторов) [5]. Интерес к изучению оптических мод в системе микрорезонаторов значительно вырос в связи с созданием оптоэлектронных устройств [6,7].

В настоящее время интенсивно развивается фотоника несовершенных структур. Здесь стоит отметить резонаторы на основе дефектов в фотонных кристаллах [8]. В частности, работы авторов посвящены изучению оптической активности несовершенных фотонных кристаллов [9], дисперсии экситоноподобных электромагнитных возбуждений в неидеальной решетке связанных микрорезонаторов [10,11]. Проводимые в рамках неидеальной фотоники исследования весьма актуальны, поскольку они позволяют путем введения в изучаемую систему опре-

деленных дефектов или в результате управляемого внешнего воздействия добиваться необходимого изменения ее энергетической структуры и оптических свойств, обусловленных перестройкой поляритонного спектра.

В данной работе на основе представлений о фотонных структурах [10,11] рассмотрен поляритонный двумерный кристалл как топологически упорядоченная система туннельно-связанных микрорезонаторов, содержащих атомарные кластеры–квантовые точки. Изучены особенности поляритонного спектра в такой двумерной решетке микропор, вызванные однородной упругой деформацией структуры.

2. Теоретическая модель

Упругая деформация двумерной структуры. Для конкретизации задачи рассмотрим двумерную (в плоскости XOY) решетку микропор (на рис. 1, *a, б* представлены модельные структуры: недеформированная и деформированная решетки). В условиях одноосных (вдоль единичного вектора \mathbf{q}) напряжений сжатия или растяжения, при однородном деформировании исследуемого массива, которое описывается с помощью тензора деформации $\hat{\varepsilon}$, положение каждой микропоры меняется. В этом случае тензор $\hat{\varepsilon}$ имеет вид

$$\varepsilon_{ij} = \sigma S_{ijkl} q_i q_j = \sigma (S_{ijxx} q_x^2 + 2S_{ijxy} q_x q_y + S_{ijyy} q_y^2), \quad (1)$$

где σ – напряжение, S_{ijkl} – тензор коэффициентов упругой податливости [12]. В условиях однородной деформации постоянные решетки $\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})$, $\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})$ приобретают зависимость от тензора деформации:

$$\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon}) = (\hat{I} + \hat{\varepsilon}) \mathbf{a}_1^{(0)}, \quad \mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon}) = (\hat{I} + \hat{\varepsilon}) \mathbf{a}_2^{(0)}, \quad (2)$$

где \hat{I} – единичный тензор; $\mathbf{a}_1^{(0)}$, $\mathbf{a}_2^{(0)}$ – векторы решетки недеформированной структуры, $\mathbf{a}_1^{(0)} \parallel OX$, $\mathbf{a}_2^{(0)} \parallel OY$.

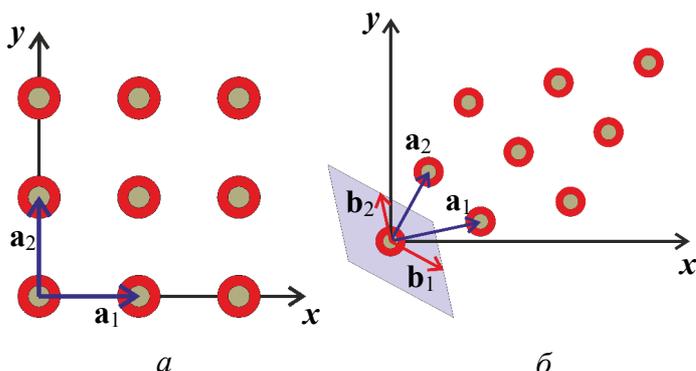


Рис. 1. Двумерные недеформированная (*a*) и деформированная (*б*) решетки микрорезонаторов со встроенными квантовыми точками: \mathbf{a}_1 , \mathbf{a}_2 и \mathbf{b}_1 , \mathbf{b}_2 – векторы соответственно прямой и обратной решеток; затемненный параллелограмм соответствует первой зоне Бриллюэна

В дальнейшем полагаем недеформированную решетку Бравэ квадратной. Для такой структуры векторы решетки деформированной структуры равны: $\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon}) = [(1 + \varepsilon_{xx})a, \varepsilon_{xy}a]$, $\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon}) = [\varepsilon_{xy}a, (1 + \varepsilon_{yy})a]$. Здесь a – постоянная квадратной двумерной решетки. Из вышесказанного следует, что векторы решетки в результате упругой деформации меняются не только по направлению, но и по модулю.

В дальнейшем для получения поляритонного спектра нам потребуются векторы $\mathbf{b}_1(\hat{\varepsilon})$, $\mathbf{b}_2(\hat{\varepsilon})$, определяющие зону Бриллюэна обратной двумерной деформированной решетки, которые находятся из соотношения: $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$, где

$$\mathbf{b}_1(\hat{\varepsilon}) = \frac{2\pi}{\Delta(\hat{\varepsilon})} [a_2^y(\hat{\varepsilon}), -a_2^x(\hat{\varepsilon})], \quad \mathbf{b}_2(\hat{\varepsilon}) = \frac{2\pi}{\Delta(\hat{\varepsilon})} [-a_1^y(\hat{\varepsilon}), a_1^x(\hat{\varepsilon})]. \quad (3)$$

Здесь $\Delta(\hat{\varepsilon}) = a_1^x(\hat{\varepsilon})a_2^y(\hat{\varepsilon}) - a_1^y(\hat{\varepsilon})a_2^x(\hat{\varepsilon})$.

Поляритонный кристалл как топологически упорядоченная система пор, содержащих квантовые точки. Одним из способов создания поляритонного кристалла является захват двухуровневых атомов идеальной (CROW) [2] или неидеальной [11] фотонной структурой, представляющей собой массив микрорезонаторов. Рассмотрим двумерную решетку микропор с произвольным числом s подрешеток. В каждом резонаторе находится квантовая точка (одноуровневая совокупность атомов), взаимодействующая с локализованным в резонаторе электромагнитным полем. Причем каждый из туннельно-связанных микрорезонаторов содержит по одной оптической моде.

В исследуемом случае упругих деформаций гамильтониан \hat{H} рассматриваемой системы зависит от тензора $\hat{\varepsilon}$. В координатном представлении $\hat{H}(\hat{\varepsilon})$ имеет вид

$$\hat{H}(\hat{\varepsilon}) = \hat{H}_{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) + \hat{H}_{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) + \hat{H}_{\text{int}}. \quad (4)$$

В (4) гамильтонианы атомарной \hat{H}_{at} и фотонной \hat{H}_{ph} подсистем, а также их взаимодействия \hat{H}_{int} соответственно равны: $\hat{H}_{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) = \sum_n \hat{H}_{\text{at},n} + \frac{1}{2} \sum_{n,m} \hat{V}_{nm}(\hat{\varepsilon})$,

$\hat{H}_{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) = \sum_n \hat{H}_{\text{ph},n} - \frac{1}{2} \sum_{n,m} \hat{A}_{nm}(\hat{\varepsilon})$, $\hat{H}_{\text{int}} = \sum_n \hat{G}_n$. Здесь $\hat{V}_{nm}(\hat{\varepsilon})$ – оператор кулоновского взаимодействия квантовой точки в резонаторе n с квантовой точкой в m -м резонаторе деформированного массива; $\hat{A}_{nm}(\hat{\varepsilon})$ – оператор, описывающий перекрытие оптических полей n -го и m -го резонаторов деформированного массива микропор (и, следовательно, определяющий вероятность перескока соответствующего электромагнитного возбуждения); $\hat{H}_{\text{at},n}$ – гамильтониан неподвижной (ультрахолодной) квантовой точки в n -м резонаторе; $\hat{H}_{\text{ph},n}$ – оператор, опреде-

ляющий состояние локализованного в n -м резонаторе электромагнитного возбуждения. Предполагаем, что деформации массива малы. Это позволяет пренебречь изменением параметров микрорезонаторов и размещенных в них атомарных кластеров. Форма записи оператора взаимодействия \hat{H}_{int} в виде суммы унарных операторов \hat{G}_n справедлива в предположении, что локализованное в n -м резонаторе электромагнитное возбуждение взаимодействует лишь с квантовой точкой, находящейся в этом же резонаторе. Индексы n и m являются сложными и определяются следующими выражениями: $n \equiv (\mathbf{n}, \alpha)$, $m \equiv (\mathbf{m}, \beta)$, где двумерные векторы \mathbf{n} , \mathbf{m} характеризуют положение элементарной ячейки решетки, а числа α , β , которые определяют номер подрешетки, принимают значения $1, 2, 3, \dots, s$.

Следуя [13,14], проведем расчет поляритонного энергетического спектра исследуемой системы, записав гамильтониан $\hat{H}(\hat{\varepsilon})$ в представлении вторичного квантования. Микроскопический расчет оптических характеристик, отвечающих поляритонной области спектра, предполагает известным явный вид соответствующего гамильтониана $\hat{H}^{\text{pol}}(\hat{\varepsilon})$. Выделение поляритонной части гамильтониана $\hat{H}^{\text{pol}}(\hat{\varepsilon})$ из (4) для рассматриваемой системы осуществим, используя поэтапный метод приближенного вторичного квантования [15].

Согласно этому методу необходимые для выполнения указанной процедуры волновые функции квантовых точек $\varphi_{\mathbf{n}f}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon})$ и локализованных в микрорезонаторе электромагнитных возбуждений $\varphi_{\mathbf{n}\lambda}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon})$, а также соответствующие им энергии $E_{f\alpha}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon})$, $E_{\lambda\alpha}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon})$ удовлетворяют системе самосогласованных интегродифференциальных уравнений, вытекающей из решения вариационной задачи [15]:

$$\begin{aligned} \left[\hat{H}_{\text{at},\mathbf{n}\alpha} + \hat{W}_{\mathbf{n}\alpha}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \right] \varphi_{\mathbf{n}\alpha,f}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) &= E_{f\alpha}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \varphi_{\mathbf{n}\alpha,f}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}), \\ \left[\hat{H}_{\text{ph},\mathbf{n}\alpha} - \hat{W}_{\mathbf{n}\alpha}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \right] \varphi_{\mathbf{n}\alpha,\lambda}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) &= E_{\lambda\alpha}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \varphi_{\mathbf{n}\alpha,\lambda}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}), \end{aligned} \quad (5)$$

где

$$\begin{aligned} W_{\mathbf{n}\alpha}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) &= \sum_{\mathbf{m}\beta \neq \mathbf{n}\alpha} \left\langle \varphi_{\mathbf{m}\beta}^{0,\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \left| \hat{V}_{\mathbf{n}\alpha\mathbf{m}\beta}(\hat{\varepsilon}) \right| \varphi_{\mathbf{m}\beta}^{0,\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \right\rangle, \\ W_{\mathbf{n}\alpha}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) &= \sum_{\mathbf{m}\beta \neq \mathbf{n}\alpha} \left\langle \varphi_{\mathbf{m}\beta}^{0,\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \left| \hat{A}_{\mathbf{n}\alpha\mathbf{m}\beta}(\hat{\varepsilon}) \right| \varphi_{\mathbf{m}\beta}^{0,\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \right\rangle. \end{aligned}$$

В одноуровневой модели в соотношении (5) индекс f принимает значения 0 и a , а индекс λ – значения 0 и 1. В предположении, что плотность возбужденных состояний элементов в атомарной и резонаторной подсистемах мала, поляритонный

гамильтониан $\hat{H}^{\text{pol}}(\hat{\varepsilon})$, полученный в приближении Гайтлера–Лондона, имеет вид [13,14]:

$$\begin{aligned} \hat{H}^{\text{pol}}(\hat{\varepsilon}) = & \sum_{n\alpha} \hbar\omega_{\alpha}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \hat{B}_{n\alpha a}^+ \hat{B}_{n\alpha a} + \sum_{n\alpha, m\beta} V_{n\alpha m\beta}^{(a)}(\hat{\varepsilon}) \hat{B}_{n\alpha a}^+ \hat{B}_{m\beta a} + \sum_{n\alpha} \hbar\omega_{\alpha 1}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \hat{\Psi}_{n\alpha 1}^+ \hat{\Psi}_{n\alpha 1} - \\ & - \sum_{n\alpha, m\beta} A_{n\alpha m\beta}(\hat{\varepsilon}) \hat{\Psi}_{n\alpha 1}^+ \hat{\Psi}_{m\beta 1} + \sum_{n\alpha} g_{n\alpha}(\hat{\varepsilon}) \left(\hat{\Psi}_{n\alpha 1}^+ \hat{B}_{n\alpha a} + \hat{\Psi}_{n\alpha 1} \hat{B}_{n\alpha a}^+ \right) = \sum_{\mathbf{k}} H^{\text{pol}}(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k}). \quad (6) \end{aligned}$$

Здесь $\Psi_{n\alpha 1}^+$, $\Psi_{n\alpha 1}$, $\hat{B}_{n\alpha a}^+$, $\hat{B}_{n\alpha a}$ – бозе-операторы рождения и уничтожения соответственно фотонной моды и возбужденного состояния квантовой точки в узельном представлении; $\hbar\omega_{\alpha 1}^{\text{ph}} = E_{\alpha 1}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) - E_{\alpha 0}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon})$, $\hbar\omega_{\alpha a}^{\text{at}} = E_{\alpha a}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) - E_{\alpha 0}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon})$ – энергии возбуждений соответственно электромагнитного поля и квантовой точки, локализованных в произвольном узле α -й подрешетки. Причем

$$V_{nm}^{(a)}(\hat{\varepsilon}) \equiv \left\langle \varphi_{n0}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \varphi_{ma}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \left| \hat{V}_{nm}(\hat{\varepsilon}) \right| \varphi_{m0}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \varphi_{na}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \right\rangle,$$

$$g_n(\hat{\varepsilon}) \equiv \left\langle \varphi_{n0}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \varphi_{n1}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \left| \hat{G}_n \right| \varphi_{na}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \varphi_{n0}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \right\rangle = \left\langle \varphi_{na}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \varphi_{n0}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \left| \hat{G}_n \right| \varphi_{n0}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) \varphi_{n1}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \right\rangle,$$

$$A_{nm}(\hat{\varepsilon}) \equiv \left\langle \varphi_{n0}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \varphi_{m1}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \left| \hat{A}_{nm}(\hat{\varepsilon}) \right| \varphi_{m0}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \varphi_{n1}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) \right\rangle$$

– матрицы резонансного взаимодействия, соответствующие в данном приближении [14] операторам $\hat{V}_{n\alpha m\beta}(\hat{\varepsilon})$, $\hat{G}_{n\alpha}$, $\hat{A}_{n\alpha m\beta}(\hat{\varepsilon})$. Последнее равенство в (6) (сумма по \mathbf{k}) оказалось возможным в силу сохранения трансляционной инвариантности системы при однородных деформациях. Заметим, что волновой вектор \mathbf{k} , характеризующий собственные состояния поляритонов (экситоноподобных электромагнитных возбуждений [10]), в исследуемой системе изменяется в пределах первой зоны Бриллюэна (затемненный участок на рис. 1,б), которая вследствие однородной деформации является функцией тензора деформации $\hat{\varepsilon}$.

Нахождение поляритонного спектра осуществляется путем диагонализации гамильтониана $H^{\text{pol}}(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k})$ (6). Так как $\hat{H}^{\text{pol}}(\hat{\varepsilon} \neq 0)$ и $\hat{H}^{\text{pol}}(\hat{\varepsilon} = 0)$ по форме совпадают в силу сохранения трансляционной инвариантности рассматриваемой структуры при однородной деформации, то поляритонный энергетический спектр можно найти с помощью дисперсионного уравнения (12) в [11] путем замены $\varphi_{n\alpha f}^{\text{at}} \rightarrow \varphi_{n\alpha f}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon})$, $\varphi_{n\alpha \lambda}^{\text{ph}} \rightarrow \varphi_{n\alpha \lambda}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon})$, $\hat{V}_{n\alpha m\beta}^{(a)} \rightarrow \hat{V}_{n\alpha m\beta}^{(a)}(\hat{\varepsilon})$, $\hat{A}_{n\alpha m\beta} \rightarrow \hat{A}_{n\alpha m\beta}(\hat{\varepsilon})$, $g_{n\alpha} \rightarrow g_{n\alpha}(\hat{\varepsilon})$, $\omega_{\alpha a}^{\text{at}} \rightarrow \omega_{\alpha a}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon})$, $\omega_{\alpha 1}^{\text{ph}} \rightarrow \omega_{\alpha 1}^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon})$.

В дальнейшем ограничимся исследованием одноподрешеточной системы. Из вышесказанного следует, что поляритонный спектр определяется равенством

$$\left\| \begin{array}{cc} \hbar\omega_{\alpha}^{\text{at}}(\hat{\varepsilon}) + V(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k}) - \hbar\Omega(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k}) & g(\hat{\varepsilon}) \\ g(\hat{\varepsilon}) & \hbar\omega_1^{\text{ph}}(\hat{\varepsilon}) - A(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k}) - \hbar\Omega(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k}) \end{array} \right\| = 0, \quad (7)$$

где $V(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k})$ и $A(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k})$ – фурье-образы $V(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{m}} V_{\mathbf{nm}}^{(a)}(\hat{\varepsilon}) \exp\{i\mathbf{k}[\mathbf{r}_{\mathbf{n}}(\hat{\varepsilon}) - \mathbf{r}_{\mathbf{m}}(\hat{\varepsilon})]\}$,

$A(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{m}} A_{\mathbf{nm}}(\hat{\varepsilon}) \exp\{i\mathbf{k}[\mathbf{r}_{\mathbf{n}}(\hat{\varepsilon}) - \mathbf{r}_{\mathbf{m}}(\hat{\varepsilon})]\}$ матриц $V_{\mathbf{nm}}^{(a)}(\hat{\varepsilon})$, $A_{\mathbf{nm}}(\hat{\varepsilon})$ резонансного

взаимодействия. В рамках используемой модели эти величины в приближении ближайших соседей приобретают следующую форму:

$$V(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k}) \cong 2 \left\{ \begin{array}{l} V[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})] \cos[\mathbf{k}\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})] + V[\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] \cos[\mathbf{k}\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] + \\ + V[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon}) - \mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] \cos[\mathbf{k}(\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon}) - \mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon}))] \end{array} \right\}, \quad (8)$$

$$A(\hat{\varepsilon}, \mathbf{k}) \cong 2 \left\{ \begin{array}{l} A[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})] \cos[\mathbf{k}\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})] + A[\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] \cos[\mathbf{k}\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] + \\ + A[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon}) - \mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] \cos[\mathbf{k}(\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon}) - \mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon}))] \end{array} \right\}.$$

В дальнейшем величины $V[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})]$, $V[\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})]$, $V[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon}) - \mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})]$, $A[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})]$, $A[\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})]$, $A[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon}) - \mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})]$, которые являются компонентами матриц $V_{\mathbf{nm}}^{(a)}$, $A_{\mathbf{nm}}(\hat{\varepsilon})$ резонансного взаимодействия, соответствующие ближайшим соседям, полагаем равными следующим:

$$\left\{ \begin{array}{l} V[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})] \\ A[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})] \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} V(\mathbf{a}_1^{(0)}) \\ A[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})] \end{array} \right\} \exp\left(-\frac{|\hat{\varepsilon}\mathbf{a}_1^{(0)}|}{|\mathbf{a}_1^{(0)}|}\right), \quad \left\{ \begin{array}{l} V[\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] \\ A[\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} V(\mathbf{a}_2^{(0)}) \\ A(\mathbf{a}_2^{(0)}) \end{array} \right\} \exp\left(-\frac{|\hat{\varepsilon}\mathbf{a}_2^{(0)}|}{|\mathbf{a}_2^{(0)}|}\right).$$

В данном случае $\left\{ \begin{array}{l} V(\mathbf{a}_1^{(0)}) \\ A[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon})] \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} V(\mathbf{a}_2^{(0)}) \\ A[\mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] \end{array} \right\} \equiv \left\{ \begin{array}{l} V_0 \\ A_0 \end{array} \right\}$. Для деформированной решетки

ближайшими соседями считаем также и диагональные структурные элементы квадратной решетки. Поэтому имеет место аналогичное соотношение:

$$\left\{ \begin{array}{l} V[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon}) - \mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] \\ A[\mathbf{a}_1(\hat{\varepsilon}) - \mathbf{a}_2(\hat{\varepsilon})] \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} V(\mathbf{a}_1^{(0)} - \mathbf{a}_2^{(0)}) \\ A(\mathbf{a}_1^{(0)} - \mathbf{a}_2^{(0)}) \end{array} \right\} \exp\left(-\frac{|\hat{\varepsilon}(\mathbf{a}_1^{(0)} - \mathbf{a}_2^{(0)})|}{|\mathbf{a}_1^{(0)} - \mathbf{a}_2^{(0)}|}\right).$$

Подстановка выражений (8) в соотношение (7) приводит к закону дисперсии $\Omega_{\pm}(\hat{\epsilon}, \mathbf{k})$ поляритонных возбуждений в искомой деформированной системе микропор, который определяется как частотными характеристиками резонаторной и атомарной подсистем, так и явным видом величин $V(\hat{\epsilon}, \mathbf{k})$ и $A(\hat{\epsilon}, \mathbf{k})$, а также характером деформации (например, одноосным растяжением или сжатием).

3. Результаты работы и их обсуждение

Численный расчет соответствующих величин, определяющих особенности спектра поляритонных возбуждений, вызванные упругой деформацией двумерной структуры микропор при одноосной деформации, проведен для однородной изотропной среды: $\epsilon_{xx} \equiv \epsilon_1, \epsilon_{yy} \equiv \epsilon_2, \epsilon_{xy} = \epsilon_{yx} \equiv \epsilon_3$. Полагаем, что в рамках используемой модели Гайтлера–Лондона (для которой $\hbar\omega_{\text{at}} \gg V_0$ [13]) значения частоты резонансной фотонной моды (электромагнитного поля, локализованного в резонаторах решетки) $\omega_{\text{ph}} = 2\pi \times 311$ THz и частоты перехода одноуровневой квантовой точки $\omega_{\text{at}} = 2\pi \times 382$ THz атомарной подсистемы решетки не зависят от тензора деформации $\hat{\epsilon}$. Значения параметров, определяющих взаимодействие атомарной и фотонной подсистем, перекрытия оптических полей и взаимодействие квантовых точек в соседних микропорах взяты следующими: $g/\hbar = 9 \cdot 10^{13}$ Hz (зависимостью этой величины от тензора деформации в данном случае можно пренебречь, поскольку, как отмечалось выше, в рамках исследуемой модельной системы деформация микропор отсутствует), $A_1/2\hbar = A_2/2\hbar = 3.5 \cdot 10^{14}$ Hz, $A_{12}/2\hbar = 2.6 \cdot 10^{14}$ Hz, $V_0/2\hbar = 9 \cdot 10^{13}$ Hz, причем $a = 3 \cdot 10^{-7}$ м.

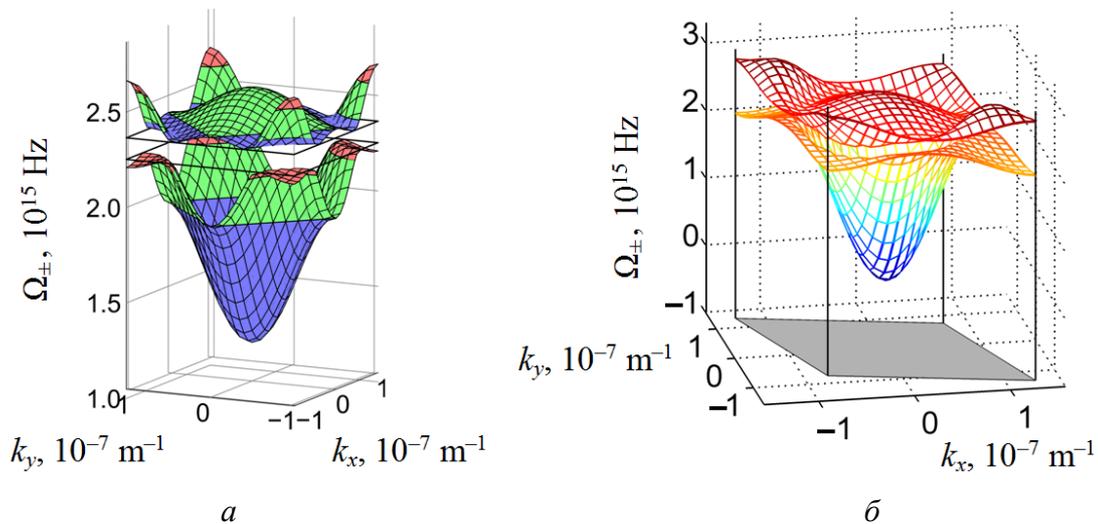


Рис. 2. Дисперсионные зависимости поляритонов $\Omega_{\pm}(\mathbf{k})$ в недеформированной (а) и деформированной (б) решетках микрорезонаторов. Затемненный участок в плоскости $k_x - k_y$ на рис. 2,б соответствует первой зоне Бриллюэна

На рис. 2,а представлены дисперсионные поверхности $\Omega_{\pm}(\mathbf{k})$ недеформированной двумерной решетки, а рис. 2,б отражает зависимость $\Omega_{\pm}(\hat{\epsilon}, \mathbf{k})$ деформированной модельной системы для значений компонент тензора деформации $\epsilon_1 = 0.1$, $\epsilon_2 = 0.1$, $\epsilon_3 = 0.3$. Из сравнения рис. 2,а и 2,б видно, что в результате произвольной деформации исследуемой двумерной структуры ход дисперсионных поверхностей, а также расположение критических точек (которые проявляются в плотности состояний и экспериментально наблюдаемых оптических характеристиках) изменяются.

4. Выводы

Выполненное в работе исследование зависимости поляритонных параметров несовершенной бинарной двумерной сверхрешетки связанных микрорезонаторов, содержащих одноуровневые квантовые точки, показывает, что путем упругих деформаций изучаемой системы можно перестраивать ее поляритонный спектр и таким образом изменять ее энергетическую структуру и оптические свойства. Предложенный численный расчет расширяет возможности моделирования поляритонных систем, представляющих собой разновидность функциональных материалов с контролируемым распространением электромагнитных возбуждений.

1. С.В. Дмитриев, Ю.А. Баимова, ЖТФ **81**, 71 (2011).
2. A.P. Alodjants, I.O. Barinov, S.M. Arakelian, J. Phys. **B43**, 095502 (2010).
3. E.S. Sedov, A.P. Alodjants, S.M. Arakelian, Y.Y. Lin, R.-K. Lee, Phys. Rev. **A84**, 013813 (2011).
4. J.D. Joannopoulos, S.G. Johnson, J.N. Winn, R.D. Meade, Photonic Crystals: Molding the Flow of Light, Princeton University Press, Princeton (2008).
5. K.J. Vahala, Nature **424**, 839 (2003).
6. М.А. Калитиевский, Письма в ЖТФ **23**, вып. 3, 74 (1997).
7. В.Г. Голубев, А.А. Дукин, А.В. Медведев, А.Б. Певцов, А.В. Селькин, Н.А. Феоктистов, ФТП **37**, 860 (2003).
8. J. Vučković, M. Lončar, A. Scherer, Phys. Rev. **B43**, 016608 (2001).
9. V.V. Romyantsev, S.A. Fedorov, K.V. Gumennyk, M.V. Proskurenko, Physica **B442**, 57 (2014).
10. V.V. Romyantsev, S.A. Fedorov, K.V. Gumennyk, M.V. Sychanova, A.V. Kavokin, Nature. Scientific Reports **4**, 6945 (2014).
11. V.V. Romyantsev, S.A. Fedorov, K.V. Gumennyk, M.V. Sychanova, Physica **B461**, 32 (2015).
12. Ю.И. Сиротин, М.П. Шаскольская, Основы кристаллооптики, Наука, Москва (1975).
13. В.М. Агранович, Теория экситонов, Наука, Москва (1968).
14. А.С. Давыдов, Теория молекулярных экситонов, Наука, Москва (1968).
15. Н.Н. Боголюбов, Избранные труды, Наукова думка, Киев (1970).

V.V. Rumyantsev, S.A. Fedorov

PROPAGATION OF ELECTROMAGNETIC EXCITATIONS THROUGH A STRAINED ARRAY OF MICRORESONATORS

The polariton spectrum in a binary two-dimensional superlattice of coupled microresonators (microcavities) with embedded one-level quantum dots is studied. It is shown that elastic deformations result in a notable transformation of polariton spectrum of the studied system and thus permit to control its energy and optical properties.

Keywords: polariton spectrum, deformation tensor, microresonator, quantum dot

Fig. 1. Two-dimensional undeformed (a) and deformed (\bar{b}) microcavity lattice with embedded quantum dots: \mathbf{a}_1 , \mathbf{a}_2 and \mathbf{b}_1 , \mathbf{b}_2 denote, correspondingly, the direct and reciprocal lattice vectors. The shaded parallelogram depicts the first Brillouin zone

Fig. 2. Polariton dispersion dependencies $\Omega_{\pm}(\mathbf{k})$ in an undeformed (a) and deformed (\bar{b}) microresonator lattices. The shaded area in the k_x-k_y plane in Fig. 2, \bar{b} corresponds the first Brillouin zone